

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

И. В. Бойков, Н. П. Кривулин. Определение временных характеристик линейных систем с распределенными параметрами

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

В. П. Гавриленко, А. Ю. Кузин, В. Б. Митюхляев, А. В. Раков, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов, В. А. Шаронов. Влияние контаминации в растровых электронных микроскопах на профиль рельефных элементов в монокристаллическом кремнии

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В. Л. Минаев. Динамический интерференционный микроскоп для измерения параметров живых биообъектов

ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Р. А. Эминов. Предельная точность одно- и двухволнового методов измерения суммарного количества водяного паров в атмосфере с учетом влияния перистых облаков

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

А. В. Завьялов, М. Н. Пущин. Методика отбраковки МОП-транзисторов по паразитному нежелательному открыванию